

# 固体辐射物理研究室知识库

ALL 输入检索关键词

首页 研究单元与专题 作者 文献类型 学科分类 知识图谱 最新动态

## XJRPC OpenIR > 固体辐射物理研究室

一种用于CMOS图像传感器单粒子行敏效应测试方法

郭斌<sup>\*</sup>, 李博东<sup>\*</sup>, 文林<sup>\*</sup>, 周东<sup>\*</sup>, 冯建, 孙松, 刘国斌, 周斌

2019-10-22

专利号: 中国科学院长春物理研究所

专利类型: 发明专利

**摘要** 本发明提供了一种用于CMOS图像传感器单粒子行敏效应测试方法。该方法是在CMOS图像传感器、CMOS图像传感器阵列板、FPGA、PC、微处理器等组成的测试系统基础上, 通过向CMOS图像传感器施加不同电压的辐射粒子, 从图像阵列板中获取辐射粒子的具体位置, 在图像阵列板中获取辐射粒子的具体位置, 同时采集辐射粒子, 通过分析辐射粒子的具体位置, 分析辐射粒子的具体位置, 从而实现对辐射粒子的具体位置, 从而实现对辐射粒子的具体位置, 从而实现对辐射粒子的具体位置。

申请日期: 2019-08-07

申请号: CN201910724249.X

公开(公告)号: 110361616A

代理机构: 青岛永齐专利事务所(普通合伙) 65106

文献类型: [专利]

文献标识码: http://ir.sanshanzu.cn/handle/355002/7322

关键词: 固体辐射物理研究室

推荐引用方式: 郭斌, 李博东, 文林, 周东, 冯建, 孙松, 刘国斌, 周斌. 一种用于CMOS图像传感器单粒子行敏效应测试方法. 110361616A[P]. 2019-10-22. GB/T 7714

包含附件: 暂无附件

所有评论 (0) [发表评论/添加评论]

### 个性服务

推荐书目

保存到我的库

最新添加

全部添加

全部删除

全部更新

全部删除

全部更新

全部删除

全部更新

全部删除

全部更新

全部删除

全部更新

全部删除

全部更新

全部删除

全部更新

全部删除

全部更新